

布里渊 (Brillouin) 散射

王卫国

(同济大学 Pohl 固体物理研究室)

1922 年, 法国物理学家 Brillouin, 通过对液体中密度起伏引起光散射的研究, 首先预言了在散射光中, 除了原先入射光的频率成分之外, 还应有频率变更了的成分。它们对称地分布于频率与入射光等同的瑞利 (Rayleigh) 线的两侧, 形成边带谱。这样, Brillouin 就将当时光散射的概念, 从弹性散射开拓到非弹性散射的领域, 开始了光散射频谱研究的新纪元。

1928 年由印度物理学家喇曼 (Raman) 所观测到的 Raman 散射, 也是非弹性散射。但是, 在物理根源上是不同的: Raman 散射来自光子与光学声子的耦合; 而 Brillouin 散射, 参与散射过程的是声学声子。所以 Raman 散射的频移高达几千 $[cm^{-1}]$, 而 Brillouin 散射只是局限在 0.01—几个 $[cm^{-1}]$ 的范围内。这种差异也就要求我们采用不同的观测手段: 对于 Raman 散射通常采用双联或三联光栅作为分光系统; 而 Brillouin 散射必须采用多通 Fabry-Perot 多光束干涉仪, 以及稳定性极高的数据采集系统。此外, 在应用方面, 尤其是 1964 年发展起来的受激 Brillouin 散射, 更有其独到之处。所有这些, 使得有必要将 Brillouin 散射与 Raman 散射分开进行研究。

我国的 Raman 散射工作, 自 1975 年以来发展很快。但是 Brillouin 散射工作起步较晚。在西德友好资助下, 我们建立了一套先进的 Brillouin 散射系统。图 1 为在该系统上做出的柱状琉璃(含有微量 OH 杂质)样品的 Brillouin 散射谱图。本文打算对 Brillouin 散射作一综合性介绍, 包括基本原理、实验系统和课题研究三个方面。

物理

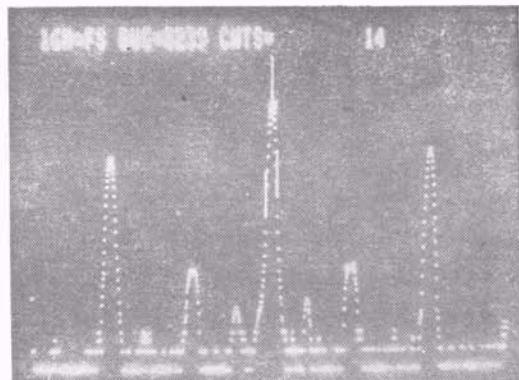


图 1 琉璃态硅的 Brillouin 散射谱

一、Brillouin 散射的基本原理

我们知道, 介质中存在一系列的弹性热波。由于它们沿着各个可能方向的传播, 在介质中形成一种复杂的随时间变化的密度涨落。假如有一束单色平行光投射其中, 则由于弹性波的这种光学非均匀性的调制作用, 在各个可能的方向上都存在散射光。但是, 在某一方向上所观测到的散射光, 只是那些满足布拉格 (Bragg)

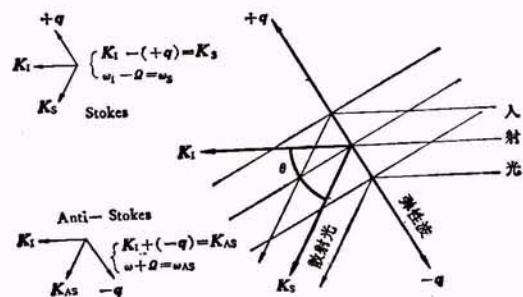


图 2 Brillouin 散射原理图

条件的弹性波作出的贡献。

Brillouin 散射的频移甚微，所以散射光的波矢和入射光的波矢在数值上几乎相等。因此，在给定入射光的波矢 \mathbf{K}_i 和观测散射光的角度 θ 之后，如图 2 所示，我们只能从许多弹性波中挑选出波矢为 $+\mathbf{q}$ 和 $-\mathbf{q}$ 的二组弹性波（频率同为 Ω ，但传播方向相反），它们满足 Bragg 条件。对于 $+\mathbf{q}$ ：

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{K}_i - (+\mathbf{q}) = \mathbf{K}_s; \\ \omega_i - \Omega = \omega_s \text{ 能量转移给介质, 激发声子。} \end{array} \right.$$

对于 $-\mathbf{q}$ ：

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{K}_i + (-\mathbf{q}) = \mathbf{K}_{AS}; \\ \omega_i + \Omega = \omega_{AS} \text{ 从介质中得到能量, 涅灭声子。} \end{array} \right.$$

频率为 ω_s 和 ω_{AS} 对称地分布于 Rayleigh 线两侧的这二根新谱线，即通常称谓的斯托克斯 (Stokes) 线和反斯托克斯 (Anti-Stokes) 线。如果入射光的电场表示为

$$\mathbf{E}_i(t) = E_{i0}\mathbf{e}_i \cdot e^{i(\omega_i t - \mathbf{K}_i \cdot \mathbf{r})}, \quad (1)$$

则散射光中的 Stokes 成分为

$$\mathbf{E}_s(t) = E_{s0}\mathbf{e}_s \cdot e^{i[(\omega_i - \Omega)t - \mathbf{K}_s \cdot \mathbf{r}]}. \quad (2)$$

散射光中的 Anti-Stokes 成分为

$$\mathbf{E}_{AS}(t) = E_{AS0}\mathbf{e}_s \cdot e^{i[(\omega_i + \Omega)t - \mathbf{K}_{AS} \cdot \mathbf{r}]}, \quad (3)$$

式中 \mathbf{e}_i 和 \mathbf{e}_s 分别为入射光和散射光的偏振单位矢量。

在接近 Brillouin 区中心，声频支的色散关系是线性的。因此，通过简单的几何关系可得介质中沿着波矢 \mathbf{q} 方向传播的弹性波速度

$$v = \frac{\Omega}{\frac{2\pi}{\lambda} 2n \cdot \sin \frac{\theta}{2}}, \quad (4)$$

式中 λ 为人射光的波长， n 为介质的折射率。对 Brillouin 散射频移量的测量，就可方便地计算出声速。从而介质的弹性常数和声速的各向异性、弛豫过程、相变、声子与其它低频激发的相互作用均能得到很好地研究。

在无弹性波吸收的情况下，Brillouin 散射谱线应是很窄的锐线，线宽近似为零。在有弹性波吸收的情况下，我们要用 Stokes 方程来描述弹性波。则散射光的电场表示式 (2) 和 (3) 前要乘以一个随时间变化的衰减因子 $e^{-\frac{\Gamma_{q^2}}{2} t}$ 。

经过傅里叶 (Fourier) 展开，Brillouin 谱线的强度将随频率有一个分布。通常用半宽度来描述这种谱线增宽效应。数值上

$$\delta\omega = 2\Gamma q^2 = 2\alpha v, \quad (5)$$

式中 α 为弹性波在介质中 1cm 路程内的阻尼幅度系数， v 为弹性波的速度。于是，从 Brillouin 谱线的半线宽和对应声速的测定，就可方便地计算出阻尼幅度系数 α 。从而可以研究介质由于非简谐性、载流子阻尼、结构弛豫、共振吸收或者其它的一些机理引起的声衰减特性。

除了上述的频移和线宽两个基本的参量之外，对于 Brillouin 散射，还有第三个重要参量，即瑞利比。它表示对应于单位入射强度、单位体积散射进入单位立体角中的光通量，或者说是单位体积的微分截面。具体的数学表示如下：

$$R^i = B \cdot \frac{[\mathbf{e}_s \cdot \mathbf{T}^i \cdot \mathbf{e}_i]^2}{\rho v_i^2}, \quad (6)$$

式中 ρ 是晶体密度， v 为速度， \mathbf{e}_i 和 \mathbf{e}_s 分别表示入射光和散射光的偏振单位矢量， \mathbf{T}^i 为晶体的 Brillouin 散射张量，角标 i 表示有关的物理量是属于第 i 个声学模的， B 是一个散射系数(与

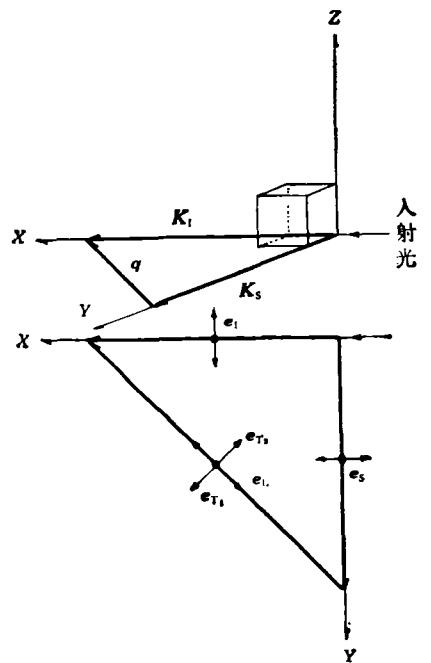


图 3 立方晶体的散射配置

表 1

频 移 \ 散射系数	R_{ZZ}	R_{ZX}	R_{YZ}	R_{YX}
$\frac{\Omega_{T_1}}{\omega} = \sqrt{2 \frac{C_{44}}{\rho}} \cdot \frac{n}{c}$ 横波, 偏振 \perp 散射平面	0	$\frac{1}{2} \frac{p_{44}^2}{C_{44}}$	$\frac{1}{2} \frac{p_{44}^2}{C_{44}}$	0
$\frac{\Omega_{T_2}}{\omega} = \sqrt{\frac{C_{11} - C_{12}}{\rho}} \cdot \frac{n}{c}$ 横波, 偏振 \parallel 散射平面	0	0	0	0
$\frac{\Omega_L}{\omega} = \sqrt{\frac{C_{11} + C_{12} + 2C_{44}}{\rho}} \cdot \frac{n}{c}$ 纵波	$\frac{2p_{12}^2}{C_{11} + C_{12} + 2C_{44}}$	0	0	$\frac{2p_{44}^2}{C_{11} + C_{12} + 2C_{44}}$

温度、材料和散射光的波长有关), 在既定的实验中看作是单位量。对于立方晶体, 如果采取图 3 所示的几何配置, 即入射光沿 X 轴方向 ($\mathbf{K}_1: K_1, 0, 0$), 散射光沿 Y 轴方向 ($\mathbf{K}_s: 0, K_1, 0$), 则由克利斯托夫 (Christoffel) 系数方程可以解出二个纯的横模和一个纯的纵模^[1]:

横模 $T_1(\mathbf{e}_{T_1}: 0, 0, 1)$

$$\rho v_{T_1}^2 = C_{44}$$

横模 $T_2(\mathbf{e}_{T_2}: \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$

$$\rho v_{T_2}^2 = \frac{1}{2} (C_{11} - C_{12})$$

纵横 $L(\mathbf{e}_L: \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$

$$\rho v_L^2 = \frac{1}{2} (C_{11} + C_{12} + 2C_{44})$$

入射光的偏振单位矢量可以取为平行于 Z 轴 ($\mathbf{e}_i: 0, 0, 1$) 或者平行于 Y 轴 ($\mathbf{e}_i: 0, 1, 0$); 散射光的偏振单位矢量也有两种可能的取法, 平行于 Z 轴 ($\mathbf{e}_s: 0, 0, 1$) 和平行于 X 轴 ($\mathbf{e}_s: 1, 0, 0$)。对上述各种可能的情况分别进行计算, 就可得到表 1 所示的散射光关于频率和偏振方向的强度分配。表中 c 是光速; C_{11} , C_{12} 和 C_{44} 为弹性常数; p_{12} , p_{44} 为弹光系数; R 的第一个脚码表示入射光的偏振方向, 第二个脚码表示散射光的偏振方向。由表可见, 对于偏振平行于散射平面 (XY 平面) 的声学模的散射强

度始终为零。因此, 我们最多只能得到两根 Stokes 线和二根 Anti-Stokes 线。一根对应于横声学模, 另一根对应于纵声学模。通过对谱线强度和选择定则的研究, 人们可以得到关于介质基本光学性质方面的信息, 这对制造压-光和声-光器件具有重要的指导意义。

二、Brillouin 散射谱仪

Brillouin 散射的仪器配置如图 4 所示。大功率 Ar 离子激光器发出的单模光束, 经过透镜 $L_1(\phi = 5.0\text{cm}; f = 50\text{cm})$ 和光栏 D_1 聚焦在样品上。收集透镜 $L_2(\phi = 5.0\text{cm}; f = 18\text{cm})$ 收集到的散射光, 经过光栏 D_2 和准直透镜 $L_3(\phi = 5.0\text{cm}, f = 50\text{cm})$ 进入高分辨率的扫描式三通 Fabry-Perot 干涉仪。扫描后得到的单频信息, 被准直光管聚焦送入光电倍增管 (PMT) 的小孔。小孔前的干涉滤光片 I 的作用在于滤

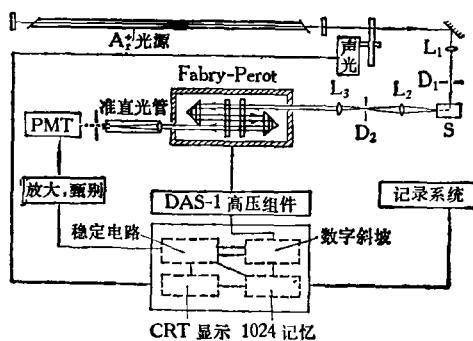


图 4 Brillouin 散射仪器配置图

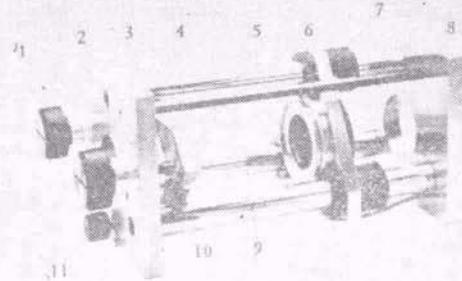


图 5 Fabry-Perot 干涉仪

1. 准直螺旋
2. 前端板
3. 钨碳接头
4. 固定镜片架
5. 钢钢滑杆
6. PZT 组件
7. 可移动的镜片架
8. 后端板
9. 腔长标尺
10. 蓝宝石部件
11. 转盘读数

去杂散光和保护光电倍增管。由 PMT 输出的电信号被放大和甄别后输给数据获得稳定系统 DAS-1。经信息处理和长时间累加(数分钟至十几小时不等)，最终由阴极射线管(CRT)显示，或者由记录系统自动给出实验结果。

上述的系统与 Raman 散射大体相同。但是由于 Brillouin 散射频移小，所以采用了分辨率高的 Fabry-Perot 干涉仪；同时由于信息微弱，配备能长时间稳定工作的数据获得稳定系统显得非常必要。下面打算就这二点作一简单介绍。

Fabry-Perot 干涉仪的结构如图 5 所示。它是由膨胀系数极小($<10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)的超级钢钢端板和三根滑杆组成骨架。二块内表面镀膜的光学镜片(平整度为 $\frac{\lambda}{200}$; $\phi = 5.0\text{cm}$)安装在其腔内。一片置于前端板附近，并可用螺旋作精细的准直调节；另一片安装在可沿滑杆滑行的 V 形钢块上。在后一片中，还配有一组片状压电陶瓷，一组用来驱动扫描，扫描范围为 $0.5 \mu\text{m}-1.0 \mu\text{m}$ ；另三组供调节镜片的倾斜度，以获得最佳的干涉条纹锐度。核心部分，是二块光学镜片。如大家知道的，对于强度为 I_0 ，波长为 λ 的投射光，经过多光束干涉后的透射光强度 I_T 可由下式表示：

$$I_T = \frac{I_0}{1 + \frac{4R \sin^2 \frac{\delta}{2}}{(1-R)^2}},$$

式中 R 为反射率， δ 为相位差。在一定条件下，

当相位差是 2π 的整数倍时，纵然镜面膜有非常高的反射率($R = 98.5\%$)，但是透射光的强度 $I_T \doteq I_0$ ，发生全透射现象。即对任意一个镜面来说，它反射了大多数的光线而只让少许的光线通过，但当二个镜片组合起来考虑时，它们却让光线透射过去了。在相位差是 π 的奇数倍时，它们又几乎是不透光的。相位差 δ 取决于镜片间距和光线频率。当 Fabry-Perot 干涉仪的镜片之一在压电陶瓷的驱动下扫描时，它就将光线按频率展开，而得到图 1 所示的周期性重复的谱图。

谱图中 Rayleigh 线的间距称为自由谱区。它是进行 Brillouin 散射必须恰当选取的重要参数。通常可用波长、频率和波数来表示：

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2d} \quad (\text{FSR 波长单位})$$

$$\Delta f = \frac{c}{2d} \quad (\text{FSR 频率单位})$$

$$\Delta\sigma = \frac{1}{2d} \quad (\text{FSR 波数单位})$$

式中 λ 为投射光的波长， c 为光速， d 为 Fabry-Perot 干涉仪二镜片的间距。我们实验中所选用的激光波长为 5145 \AA ，间距为 0.220cm ，所以自由光谱区的宽度为 68.2GHz ，相当于 $2.27 [\text{cm}^{-1}]$ 。

DAS-1 数据获得稳定系统有四个基本组成部分。

1024 道分析器：容量为 16×10^6 计数/道，供储存和控制数据；

数字式斜坡电压：同步于 1024 道主钟脉冲，经高压组件放大产生驱动 Fabry-Perot 干涉仪扫描所需要的高压；

稳定电路：用以消除漂移和保持锐度最佳；

阴极射线管(CRT) 显示单元：给出图谱以及标度、扫描次数、具体的道数和相应的计数值。

其中，稳定电路是很关键的。实验中一会儿就能观察到因环境条件和光源的微小变化而

引起 Rayleigh 线的漂移和锐度下跌。这意味着长时间累加得不到清晰的谱线，甚至做不出某些样品的谱图。稳定的方法是在 Rayleigh 线中心峰的两侧选取一窄的频隙(俗称窗口)，如图 1 中的竖线所示。对于轴向漂移，是在每次扫描结束时，自动比较左半窗口和右半窗口内的计数值，同时发出一个校正信号，对 Fabry-Perot 的扫描镜片作一微小的轴向校正，以保持二个半窗口内的计数相同；对于锐度变差，是程序地比较窗口内的总计数值，并轮流地给扫描镜片一微小的旋转校正，以保持窗口内的总计数值一直处于最大值，即对应于锐度最佳。

DAS-1 数据获得稳定系统，还具有一系列其它功能，如对数显示，曲线平滑和积分，分段扫描，相敏检测消除噪声，以及带动描图器和微处理机等等。

三、Brillouin 散射技术的应用

1. 固体(主要是铁电体和半导体)的晶格振动模式和振动位形的研究。

根据晶体的结构和对称性，研究基本振动模式和振动位形，是一项基础研究工作。ZnO

晶体是一种重要的压电半导体，点群是 C_{6v} 。我们曾用特征标投影算子 $\hat{\theta}$ 计算了它的正则振动，并用 Raman 技术研究了其中 Raman 活性的光学模振动。剩下三个振动方式

$$\eta^{A_{1g},1} = \frac{1}{2} (e_z^1 + e_z^2 + e_z^3 + e_z^4)$$

$$\eta^{E_{1g},1} = \frac{1}{2} (e_x^1 - e_y^3 + e_x^2 - e_y^4)$$

$$\eta^{E_{2g},1} = \frac{1}{2} (e_y^1 + e_x^3 + e_y^2 + e_x^4)$$

由图 6 所示的振动位形可知，它们表示原胞质心的运动，乃是声学模振动。因此，只能应用 Brillouin 散射技术进行研究。在我们的实验系统上，经过十多分钟的累加就得 ZnO 晶体的清晰的 Brillouin 散射谱图。

2. 结构相变的研究

由铁电相变的软模理论知道，当横向光学软声子频率 $\omega_{TO} \rightarrow 0$ 时，离子偏离平衡位置后就不受恢复力作用，于是整个晶体过渡到新的组态，发生相变。但是对于有些铁电材料，在 $\omega_{TO} \rightarrow 0$ 的过程中，横向光学软声子频率趋近横向声学声子，发生耦合和排斥，导致横向声学声子的色散曲线也变得平坦了，使与之相联系

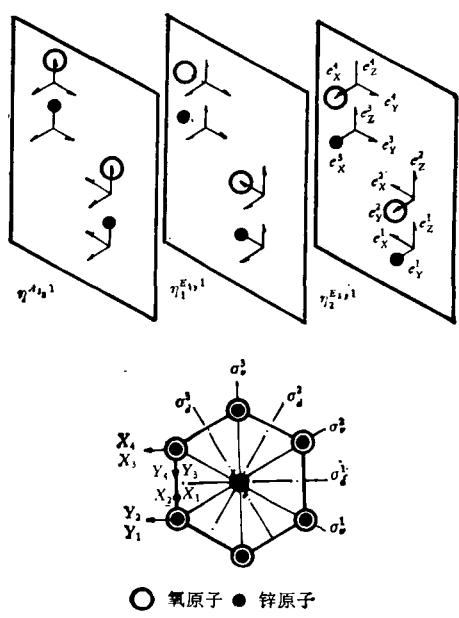


图 6 ZnO 声学模振动位形和结构俯视图

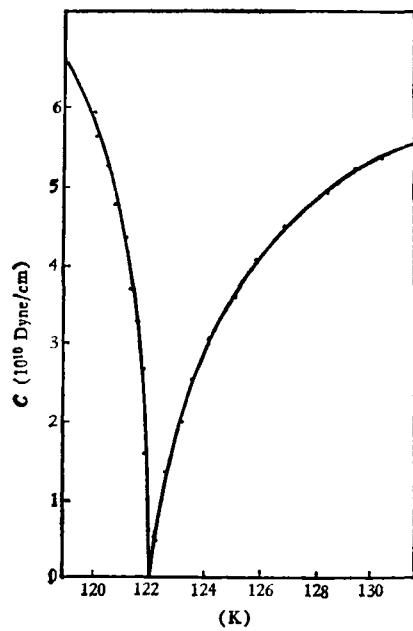


图 7 KH₂PO₄ 晶体的弹性常数与温度的关系

的一个弹性常数变为零，于是反而首先因声学声子变得不稳定而发生相变。这类相变可以通过 Brillouin 散射技术测量伴随的弹性常数异常来研究。Edward 等人研究了 KH_2PO_4 晶体，测得在 122K 附近存在上述相变，如图 7 所示。

3. 非晶态材料的研究

人们对用 Brillouin 散射技术研究非晶态材料感到兴趣。这首先是由于在研究非晶态材料中声子和缺陷的相互作用时，Brillouin 散射能到达超声测量或者热学测量所不能达到的能量范围；此外，惯常用声学方法在 mK 温度范围进行的实验，Brillouin 散射只需在液氦温度下即可完成。Hunklinger 等人^[2]首先用 Brillouin 散射技术研究了液态硅，通过对线宽的测量得到图 8 所示的结果。由图可见，在低于 4K，平均自由程有一段随温度降低而减小的过程，这对应于作为非晶态特征的双能级共振吸收。

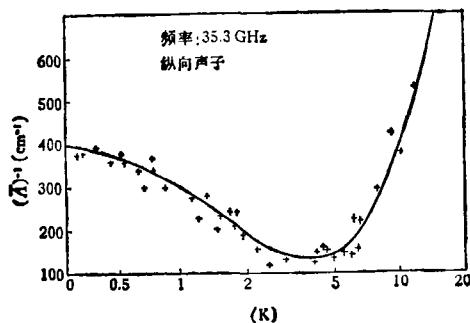
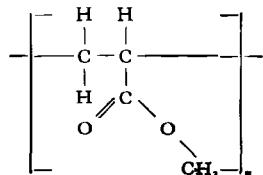


图 8 液态硅的声衰减特性

非晶态聚合物是不同于晶态固体的一类新材料。它是由成百上千的重复单元组成长链状分子。聚丙烯酸甲酯就是由



基团连接而成。在温度较低时，分子被“冷冻”固定。随着温度的升高，侧链基团能够转动，于是该聚合物就由坚硬的玻璃态转变为软橡胶态；温度继续升高，它就由软橡胶态转变为类液

态，此时分子扩散成为可能。Huang 等人应用 Brillouin 散射技术研究了聚丙烯酸甲酯声速与温度的关系，测得在 6°C 和 60°C 附近声速发生明显的转折，它们即为该材料的状态转变温度。

4. 声电效应的研究

在压电半导体中，高频声波与漂移载流子有强烈的相互作用。当载流子的速度大于声速时，它就将部分能量转移给声波，使声波的振幅增加；反之，声波将其能量传递给载流子使自己的振幅减小。外加电场能在很宽的范围内改变载流子的漂移速度，从而得到很高的放大率。Smith^[3] 用测定 Brillouin 散射谱线强度随外加电场变化的方法研究了 CdS 材料的声电效应。Brillouin 散射是以高频声子作为探针和用光作为观测手段，所以它是研究透明材料声电效应的好方法。

5. 声学声子的表面 [Brillouin 散射研究]

对于非透明材料，例如金属和半导体，光的透射深度只有几百 Å，因此，光与声子的相互作用只是局限于表面。这就使得 Brillouin 散射成为研究表面声子的有力工具。某种意义上讲，它可以与近年来发展起来的原子衍射技术相比拟。在研究表面散射截面和表面涟波产生的衍射效应方面，Loudon^[4] 和 Mills^[5] 做了不少有意义的基本理论工作；而 Sandercock^[6] 在实验工作方面一直是非常出色的。

去年九月底，西德 Dransfeld 教授在“同济大学 Pohl 研究室第一次固体物理专题讨论会”上，介绍了他用多通 Fabry-Perot 干涉仪研究 GaAs 表面背向散射的实验结果。他发现：当入射光的强度从 0.2W 增加到 1.0W ($h\nu = 2\text{eV}$) 时，声表面波的强度也相应地增大大约五倍。这意味着被吸收的光能一部分地转化为声表面波。而其所得到的强烈的声表面波（当激光功率为 1W 时），相当于晶格温度为 1550K。但是根据被吸收的激光功率、焦斑直径和 GaAs 的热导系数进行估算，仅为 353K，二者相差甚大。这方面的具体机理还不清楚，只能猜测也许在表面首先形成密集的高度过热的电子-空穴等离子体，然后，又可能变成光学 Fuchs-

Kliewer^[7] 表面声子，从而直接或间接地产生所观测到的声表面波。Dransfeld 教授建议将 Brillouin 散射实验扩展到其它的散射角，从而可以得到激发起的弹性表面波频率分布的更多知识；还建议在 20K 以下进行实验。这是一项有意义的研究工作。

6. 磁振子 (Magnon, 自旋波) 的研究

我们知道，磁性材料中，点阵自旋间相互耦合而发生的相对取向的振动，形成自旋波。自旋波的量子化就是磁振子 (Magnon)。

类似于光子-声子散射，光子与磁振子之间也存在散射效应。所以，在 Brillouin 散射技术被成功地用于研究声学声子性质的同时，该项技术也逐渐成为研究铁磁和亚铁磁材料声学磁振子的有用工具。1978 年，Sandercock^[8] 采用三通串接二通的方法，首先将研究对象扩展到多晶态金属材料 Fe 和 Ni，得到图 9 所示的磁振子谱。其中 S 为表面磁振子模式， B_s , B_{as} 为体磁振子模式。当样品磁场反向时，表面磁振子模式 S 将转移到 Rayleigh 线的另一侧。同年，Chang .P. H^[9] (物理所张鹏翔) 等人又研究了金属玻璃态 $\text{Fe}_{40} \text{Ni}_{40} \text{P}_{14} \text{B}_6$ 和 $\text{Fe}_{80} \text{B}_{20}$ ，得到用其它方法难以得到的有关磁性和弹性信息。其后，Grimsditch^[10] 进一步观测到磁振子峰分裂为亚结构，对应于垂直于膜表面的磁振子模式。

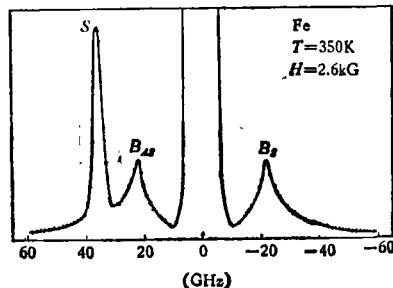


图 9 金属 Fe 的磁振子谱

子波矢的空间量子化。这个领域尚有许多研究工作值得进行。

参 考 文 献

- [1] I. L. Fabelinskii, *Molecular Scattering of Light*, Plenum Press, New York, (1968), 145.
- [2] H. J. Maris, *Phonon Scattering in Condensed Matter*, Plenum Press, New York, (1979), 61.
- [3] R. W. Smith, *J. Acoust. Soc. Am.*, **49** (1971), 1033.
- [4] R. Loudon, *Phys. Rev. Lett.*, **40** (1978), 581.
- [5] D. L. Mills, *Phys. Rev. B*, **15** (1977), 3097.
- [6] J. R. Sandercock, *Solid. St. Commun.*, **26** (1978), 547.
- [7] R. Matz et al., *Phys. Rev. Lett.*, **46** (1981), 500.
- [8] J. R. Sandercock et al., *IEEE Trans. Mag.*, **14** (1978), 442.
- [9] Chang. P. H. et al., *Solid. St. Commun.*, **27** (1978), 617.
- [10] M. Grimsditch et al., *Phys. Rev. Lett.*, **43** (1979), 711.

原子核的巨共振和辐射俘获反应

高 良 俊

(中国科学院原子能研究所)

一、什么是原子核的巨共振？

巨共振是受激原子核中多数核子参与并相干的集体运动状态。在巨共振模式中发射粒子能谱呈现出的共振峰，比单粒子激发模式发射粒子能谱的共振峰要宽大得多。为了在比较中

区别这两种共振。请看入射质子能量为 60.5 MeV，在 20° 角测得的 $^{56}\text{Fe}(p, p')$ 非弹性散射能谱 (图 1)。

从图 1 中我们会看到：激发能 E_x 在 8 MeV 以下，能谱出现许多起伏陡峭的尖锐的共振峰。通常我们称这样的共振为狭共振，狭共振峰的谱形可以用单粒子壳模型理论来解释。大约在